SOFE PATE FIRST TEADENLI KWED WHAT'S HEW

PRODUCTS & SERVICES ABOUT MICROPATENT

Next

List

First

DIEX

MicroPatent's Patent Index Database: Record 1 of 1 [Individual Record of JP2003510446T]

Order This Patent

Family Member(s)

[no drawing available]

JP2003510446T 20030318 FullText

Application Number: 3P 2001526873 T Application (Filing) Date: 20000929

Priority Data: JP 27911299 19990930 A X; JP 0006805 20000929 W V;

Original IPC (1-7): C09K00314; 824800100; 824803700; 824805702; G11800584

Other Abstracts for Family Members: CHEMABS134(19)267850T; DERABS C2001-354849











£ist.

First Frey

Next

Copyright @ 2002, MicroPatent, LLC. The contents of this page are the property of MicroPatent LLC including without limitation all text, html, asp, javascript and xml. All rights herein are reserved to the owner and this page cannot be reproduced without the express permission of the owner.

(19)日本図特許庁 (J.P) (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出屬公表番号 特表2003-510448 (P2003-510446A)

(42)公务日 平成15年3月18日(2003.3.18)

					(48) 77.8	发出 平成16年3月	18 (2203. 3. 18)
(51) Int.CL		識別記号		Pi		š	5~71~}*(參考)
C09K	3/14	5.5.0		C09K	3/14	5 5 0 D	3C047
						5 5 0 Z	3.C 0.4.9
B 2 4 B	1/00			B24B	1/00	D	3C058
	37/00				37/00	F	5D112
	57/92				57/02		
		\$	整查請求	有。予修	朱格查等	未請求(全 18 頁)	最終到江鄉 <
(21) 出願祭+		₩ % (2001 – 526873(P2001 – 5	29873)	(71) HS SS E.	A MANUS	T#ROH	
(86) (22) (8)	8 88	平812年9月29日(2000, 9, 25	3)	7,110,000			5番9毎
(85) 翻訳文指	2 883	平成13年4月20日(2001.4.2)		(71) 出題。		研工業株式会社	
(86) 国際出場	夏 爾特	PCT/JP00/0680	. 5		愛知與	名古墨市縣区喀梅町	学群品後153番
(87) (2) (8 7)	等 符	WO01/023485			*	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(87) 国際公司	# 5	华战13年4月5日(2001.4.5)	;	(72)発明。	THE		
(31) 優先報3	E要番号	特额平11−279112			長野県:	塩 尻市大字宗賀 1 番	维 昭和電工株
(32) 後先日		平成11年9月30日(1999.9.30	i)			塩尻工場内	
(33) 優先議会	H SEE COO	日本 () P)		(72)発明。	新树	正據	
					果政策	名古屋市北区福德町	五丁目38番地
				(74)代理)		石田 数 (外4	
							最終質に続く

(54) [発明の名称] 研磨用組成物および研磨方法

(57) [要約]

研磨速度を低下させずに、表面の性状、品位を高精度に 維持しながら縁ダレ衆を従来のレベルより著しく仕上げ 加工面が得られる研密用組成物を低級するために、水、 新贈材料(特にアルミナ)、研磨促進剤、および、ヒド ロキシプロピルセルロース及びヒドロキシアルキルアル キルセルロースの少なくとも一方を含む研磨用組成物を 提供する。

【特許請求の範囲】

【講求項1】 水、研磨材料、研磨促進剤、および、ヒドロキシブロビルセルロース及びヒドロキシアルキルアルキルセルロースの少なくとも一方を含む研磨用組成物。

(請求項2) 前記術館材料がアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、 酸化セリウムから選ばれる請求項1記載の研磨用組成物。

【請求項3】 前記研磨材料がアルミナである請求項1記載の研磨用組成物。

【請求項4】 研磨促進剤が有機酸又は無機酸塩からなる請求項1,2又は3に記載の研磨用組成物。

【請求項5】 研磨促進剤が有機酸と有機酸塩及び無機酸塩の少なくとも一 方とを含む請求項1,2又は3に記載の研磨用組成物。

【繭求項6】 有機酸がマロン酸、コハク酸、アジビン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、酒石酸、グルコン酸、ヘブトグルコン酸、イミノジ酢酸、フマル酸からなる群から選ばれる少なくとも1種以上である 請求項1~5のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項7】 無機酸塩が硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウム、硝酸第二鉄、塩化アルミニウム、スルファミン酸ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項1~6のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項8】 有機酸塩が請求項6に記載される有機酸のカリウム塩、ナトリウム塩、又はアンモニウム塩である請求項5に記載の研磨用組成物。

【請求項9】 研磨促進剤の含有量が組成物全体に対して0.01~10重 量%である請求項1~8のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項10】 ヒドロキシアルキルアルキルセルロースがヒドロキシブロ ピルメチルセルロース。ヒドロキシエチルメチルセルロース、エチルヒドロキシ エチルセルロースからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項1~ 9のいずれか1項に記載の研磨用組成物。 【請求項11】 ヒドロキンプロビルセルロース及びヒドロキシアルキルアルキルセルロースの前記少なくとも一方の含有量が組成物全体に対して0.00 1~2重量%である請求項1~10のいずれか1項に記載の研機用組成物。

【講求項12】 水、研磨材料、研磨促進剤、および、ヒドロキシブロビル セルロース及びヒドロキシアルキルアルキルセルロースの少なくとも一方を含む 研磨用組成物を用いて被加工物を研磨する、精密研磨方法。

【請求項13】 前記被加工物がアルミニウム磁気ディスク基板である請求項12記載の研磨方法。

【繭求項14】 前記研磨材料がアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア 、酸化セリウムから選ばれる請求項12または13記載の研磨方法。

【讀求項15】 前記研磨材料がアルミナである請求項12または13に記載の研磨方法。

【請求項16】 研磨促進剤が有機酸又は無機酸塩からなる請求項12~1 4のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項17】 研磨促進剤が有機酸と有機酸塩及び無機酸塩の少なくとも 一方とを含む請求項12~16のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項18】 有機酸がマロン酸、コハク酸、アジビン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、酒石酸、グルコン酸、ヘブトグルコン酸、イミノジ酢酸、フマル酸からなる群から選ばれる少なくとも1種以上である蓄水項12~17のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項19】 無機酸塩が硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウム、硝酸第二鉄、塩化アルミニウム、スルファミン酸ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項16~18のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項20】 有機酸塩が請求項18に記載される有機酸のカリウム塩、 ナトリウム塩、又はアンモニウム塩である請求項17に記載の研磨方法。

【請求項21】 研磨促進剤の含有量が組成物全体に対して0,01-10 重量%である請求項12-20のいずれか1項に記載の研磨方法。 【講求項22】 ヒドロキシアルキルアルキルセルロースがヒドロキシブロビルメチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロースからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項12~21のいずれか1項に記載の研磨方法。

【繭求項23】 ヒドロキンプロピルセルロース及びヒドロキシアルキルアルキルロースの前記少なくとも一方の含有量が組成物金体に対してり、001~2重量%である繭求項12~22のいずれか1項に記載の研磨方法。

【発明の詳細な説明】

100011

技術分野

本発明は、金属、プラスチック、ガラス等の精密研磨仕上げに用いられ、特に コンピューターのハードディスクドライブに組込まれるアルミニウム磁気ディス ク(以下ハードディスクという) 表面の精密仕上げに用いる研磨用組成物に関す る。

[00002]

背景技術

近年コンピューターの高性能化、コンパクト化の要請に伴い、ハードディスクにおいては、その記録密度の向上に伴って表面欠陥のない高品質の鏡面仕上げが求められてきた。この要求に応えるための表面仕上げ加工に対しては、研磨材、研磨バット、研磨機械、研磨技術等それぞれの分野での技術開発が行われてきた

100031

研磨材について見れば、特開昭62-25187号公報は研磨促進剤に硝酸二 ソケル、硝酸アルミニウム等無機塩を添加して研磨速度を高めた研磨用組成物を、特開平2-84485号公報は有機酸であるグルコン酸や乳酸とこれらのナトリウム塩を添加して研磨速度を上げると共に表面欠陥の少ない研磨仕上げ面が得られる研磨用組成物を、又特開平7-216345号公報は有機酸とモリブデン酸塩及びアルミナゾルを添加して高い研磨速度と表面欠陥のない研磨仕上げ面を得る研磨用組成物を提案している。これら発明の研磨材は何れもハードディスクの研磨速度を高く保持しつつ表面粗度をより小さく、表面欠陥をより少なくして記録密度を高める目的のものである。

[0004]

一方、特別平5-2747号公報、特別平5-89459号公報はハードディスクー校当りの記録容量を増やす方策として外周端部の縁ダレを少なくして記録 面積を拡大することを開示している。しかしこれらはいずれも研磨加工の際の条件設定に関するものであって研磨用組成物ではない。又研磨用組成物に関するも のとしてある特徴平1-263186号公報ではトリエタノールアミンカルボン酸、トリエタノール塩酸塩にステアリン酸アルミニウムを添加して緑ダレ量の減少を図っているが、面粗度の要求レベルが厳しくなった現在の高精度の研磨面仕上にはそのまま適用しがたい。

[0005]

前記公報の研磨用組成物は研磨速度を高めたり、ハードディスク表面の微小ビットや微小突起、スクラッチ等の表面欠陥を少なくして品質の向上を図るもの、表面程度をより小さくして記録密度を高める目的のものであった。一方、同一のハードディスク径であって記録容量をより高める事が求められている。前記の単位面積当りの記録密度を高くする事は当然であるが、研磨作業においてどうしても避けられないハードディスク外間部分のダレが生じて曲面になる現象があり、これを釋グレもしくはロールオフと呼んでいるが、この縁ダレ部分は記録領域として使用する事が出来ないので、できるかぎり繰グレ量を少なくする事が出来ればハードディスクー枚当りの記録容量を増す事が出来るため、この縁グレ量を極小化する課題が生じている。

本発明は、この課題に取り組みハードディスク表面研磨において研磨速度を低 下させずに、表面の性状、品位を高精度に維持しながら縁ダレ量を従来のレベル より著しく仕上げ加工面が得られる研磨用組成物を提供することを目的とするも のである。

100061

発明の開示

本発明は、水と研磨材料(特にアルミナ)、研磨促進剤、及び、ヒドロキシブロビルセルロース(以下HPCと略記する。)及びヒドロキシアルキルアルキルセルロース(以下HRRCと略記する。)の少なくとも一方を含む研磨用組成物を提供する。この研磨用組成物は、限定するわけではないが、主としてコンピューターのハードディスクドライブに組込まれるハードディスクの表面研磨に使用され、特に研磨速度、表面品質、表面程度を高精度に維持しながら縁ダレ量を従来のレベルより著しく小さくした仕上加工面を与えることができる。本発明はこの研磨組成物を用いて被加工物を研磨する方法も提供する。

[0007]

発明を実施するための最良の形態

遊離砥粒を使用する研磨加工では避けられない現象として研磨加工物の縁ダレがある。縁ダレの発生メカニズムについては必ずしも明らかではないが、研磨作業における経験から研磨速度が大きいほど縁ダレ量は小さくなるが、一般的に面粗度が大きくなり突起も発生し易い。又研磨速度が小さいほど縁ダレ量は大きくなりピットが発生し易くなるという問題が生じる。一方、研磨中、ディスクがバット面に注み込む混さが大きいほど縁ダレ量が大きくなる傾向がある。これらの知見から研磨材の研磨性能を維持しながら研磨液の粘性を高める事など種々の添加剤を検討した結果、本発明の研磨用組成物を完成するに至った。

[0.008]

本発明において縁ダレ量は、図1に示す以下の方法により規定される量とする。 。

図1に示すように、研磨したハードディスク表面の外周部分をサーフコーダーでトレースした描線Sの外周端に沿って無線hを設け、hを基準としてディスクの中心に向かい描線上の 3000μ mの点をA、 2000μ mの点をBとした時、A-Bを通る直線の延長線で無線hから 500μ mの点をCとし、点Cに垂線 kを設け該垂線kと描線Sの交点をDとし、C-D間の長さまを縁ダレ無として 測定する。

[0009]

増粘剤の縁ダレ低減効果を確認するため各種の高分子ポリマーや水溶性などを 評価した。その結果、水溶性セルロース誘導体で、溶液中でより立体的な繊維構 進を持つヒドロキシブロピルセルロース(HPC)や、ヒドロキシブロピルメチ ルセルロース(HPMC)、ヒドロキシエチルメチルセルロース(HEMC)、 エチルヒドロキシエチルセルロース(EHEC)等のヒドロキシアルキルアルキ ルセルロースを添加した場合には、研磨速度を低下させることなく、高面精度を 維持しながら縁ダレ量の少ない研磨面を得るのに特に優れている事がわかった。

[0010]

HPCやHPMC、HEMC、BHECを添加する事による縁ダレ減少作用の

メカニズムについては、明らかではないが、増粘効果と共にセルロースエーテル の分子構造や末端基の種類が寄与しているものと思われる。

[0.0.1.1]

本発明に研磨材料として好適に用いられるアルミナは、 α 、 θ 、 γ 等の結晶系にとらわれないが、研磨速度の点からは α アルミナが好ましい。粒子サイズは希望する画程度に応じて選ぶが、一般的に平均粒子サイズで0. $02\sim 5~\mu$ m、より好ましくは0. $1\sim 3~\mu$ mの範囲内がよい。粒度分布は分布幅ができる限り狭い事が望ましく、又アルミナの組成物全体にしめる割合は $1\sim 3~0$ %、より好ましくは $3\sim 2~0$ 重量%がよい。

100121

しかし、使用される研磨材料はアルミナに限定されるものではなく、シリカ、 チタニア、ジルコニア、酸化セリウムなどでもアルミナの場合と同様の結果が得 られる。これらの研磨材料は組合せて使用してもよい。

その粒子サイズ、使用量などはアルミナの場合と同様でよいが、変更可能である。

100131

本発明に用いられる研磨促進剤としては、有機酸又は無機酸塩を選ぶ事ができる。有機酸はマロン酸、コハク酸、アジピン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、補石酸、グルコン酸、ヘブトグルコン酸、イミノジ酢酸、フマル酸などからなる群から選ばれる少なくとも1種であり、無機酸塩は硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、硝酸溶二鉄、塩化アルミニウム、スルファミン酸ニッケルなどからなる群から選ばれる少なくとも1種であって、これらの含有量は研磨用組成物全体に対して0.003~10重量%の範囲がよい。

100141

本発明に用いられる研磨促進剤は有機酸と有機酸塩及び/又は無機酸塩とから なることができ、有機酸はマロン酸、コハク酸、アジピン酸、乳酸、リンゴ酸、 クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、酒石酸、グルコン酸、ヘプトグルコン酸 、イミノジ酢酸、フマル酸などからなる群から選ばれる少なくとも1種である。 有機酸と組み合わす有機酸塩は上記有機酸のカリウム塩、ナトリウム塩又はアン モニウム塩などである。有機酸と組み合わす無機酸塩は硫酸ナトリウム、硫酸マ グネシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸ニッケ ル、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウム、硝酸第二鉄、塩化アルミニウム、ス ルファミン酸ニッケルなどからなる群から選ばれる少なくとも1種である。有機 酸と有機酸塩の組み合わせ、及び有機酸と無機酸塩の組み合わせのいずれにおい ても、これらの含有量は研磨用組成物全体に対して0、01~10重量%の範囲 かよく、有機酸は少なくとも0、003重量%含有するのがよい。

尚、研磨促進剤の選定において、有機酸と有機酸塩の組合せの場合は、同種の 有機酸と有機酸塩の組合せの方が、研磨特性がよい。

100151

本発明に用いられるHPCやHPMC, HEMC, EHECの含有量は単独又は組み合わせのいずれの場合でも研磨用組成物全体に対して0.001~2重量%の範囲がよい。少な過ぎると縁ダレ改善の効果がなく、多遷ぎると研磨速度を下げる。より好ましくは0.01~1.0%の範囲である。

100161

なお、上記の各成分濃度はハードディスク基板を研磨する際の濃度である。研 磨用組成物を製造し、運搬する場合は上記濃度より濃厚な組成物とし、使用に際 して上記の濃度に薄めて使用するのが効率的である。

[0017]

本発明の研磨用組成物に添加剤としてアルミナゾル、界面活性剤、洗浄剤、防 鋳剤、防腐剤、中調整剤、更には添加により表面欠陥を抑える効果のあるものと して公知のスルファミン酸やリン酸などの表面改質剤等を、必要に応じて用いる 事ができる。

[0018]

本発明の研磨用組成物の内は2~6の範囲が好ましい。

[0019]

実施側

以下。本発明の実施例について具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例 に限定されるものではない。

[0020]

実施例1~15を第1表に、比較例1~6を第2表に示す。

100211

(研磨用組成物の調製)

機成炉にて水酸化アルミニウムを大気中でおよそ1200℃に加熱処理して。 アルミナを得しこれを粉砕、湿式分級して平均粒度0.6μm,0.7μm及び 1.0μmのアルミナ試料を作成した。

更に研磨用組成物試料として、それぞれ第1表、第2表の成分組成になるよう に、水、アルミナ、研磨促進剤、HPC又はHPMC、HEMC、EHECを秤 量、配合、混合を行い、研磨試料に供した。

100221

(研磨条件)

被研磨ワークとしては、NiーPメッキした3、5インチアルミディスクを用 い、研磨試験並びにディスク評価は下記条件で行った。

研磨試験条件

研撰試験機

- 9 B阿面研磨機 (システム精工 (株) 製)

研磨パッド

ポリテックスDG -

定盤回転数

上定盤28mm、下定盤45mm、Sunギヤ8mm

スラリー供給量

加工時間

S min

加工压力

- 80 g/cm²

[0023]

ディスクの評価方法

研磨速度

研磨前後のディスクの減少重量より算出

研磨面吊管 ピット、突起、スクラッチを顕微鏡観察により、

評価"食"は、ピット数 ≤10個/5枚(ディスク)

スクラッチ≤5個/1枚(ディスク) 姿

菱

緑グレ量 サーフコーダーSE-30D (コサカ研究所製) により 測定 (図1に図示した量)

[0024]

研磨試験の評価結果として第1表に本発明の実施例を、第2表に比較例をそれ ぞれ示した。

[0.025]

(表1)

第1表

345	a73	レミナ	š	开展	健 進 剤	**********	HPC/	研磨評	面結果	
36	粒度 D;;	:	有機	ř\$	有機酸塩/ 無機酸塩		HRSKC	研磨速度	表面 欠陥	繰ぎ レ 無
81	μm	96	種 類	%	蓬 類	%	96	#m/min		Å
1	9.7	8	H.W	0.5	乳酸ソーダ	1, 0	HPC 0.1	1.13	膜	300
2	0.6	6	乳酸	0.5	乳酸ソーダ	1. 0	HPC 0. 1	0.78	度	650
3	0, 7	₿.	乳酸	4.0	乳酸ソータ	5.0	IPC 1. 0	1. 15	展	350
4	1.0	ŝ	サンゴ酸	6. 7	リンゴ酸ソーダ	0. 2	HPC 0.1	1, 35	A	100
Ŕ	0.7	8	リンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	Ø, 2	HPC 0.1	1, 24	A	450
ê	0.6	8	リンゴ酸	0. T	リンゴ酸ソーダ	ø. 2	HPC 0. 1	0, 88	奥	600
7	0.7	8	リンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	Ç. 2	1.9	1, 04	魚	459
8	0,7	õ	リンゴ酸	5.0	リンゴ酸ソーダ	4.0	88°C 1, 0	1, 25	與	500
ş	9,7	8	サンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	0.2	HPNC 0.1	1, 22	.83	450
19	0, 7	8	リンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	0.2	HPMC 0, 1	1. 21	良	500
13	0.7	S	グルコン酸	0.5	グルコン酸ソーダ	0.5	HPC 0.1	0, 98	æ	400
12	0, 6	8	グルコン酸	0.5	グルコン酸ワーダ	0.5	HPC 0. 1	0.73	28	500
13	Ö. 7	8	乳酸	0, 5			HPC 0.1	1, 92	艮	350
14	0.7	ŝ	リンゴ酸	0.7	硫酸ニッケル	8.3	HPC 0.1	1, 09	R	450
15	0.7	8.			務階アルミ	1. 0	HPC 0. 1	1.13	.83	400

[0026]

[喪2]

第2表

比	a77	レミナ		F &	俊 進 割		torio /	a e	的特果	***********
150 (M)	粒度 Dss	**	資 機	8 6	有機酸塩/ 無機酸塩		HPC/ HRRC	研磨速度	表面 欠%	線グ レ 搬
375	μm	%	蓬 類	%	權類	%	%	⊭m/min		À
1	0.7	ş	乳酸	6, 5	乳酸ソーダ	1,0	Ģ	1.18	Ŗ	800
2	1.0	ŝ	リンゴ酸	0, 7	リンゴ酸ソーダ	9.2	Q	1.27	段	1000
3	97	3	リンゴ酸	9. 7	リンゴ酸ソーダ	0.2	O	1.18	义	1400
4	9. S	ŝ	リンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	0.2	0	9. 93	展	1900
5	9, 7	ŝ	グルコン酸	0.5	グルコン酸ソーダ	0,5	0	1.68	奧	1800
8	9, 8	ð	グルコン酸	0.5	グルコン酸ソーダ	8.5	0	0.81	段	2100

[0027]

第1表と第2表の比較から、HPC又はHPMC、HEMCを添加する事により、縁ダレ繊が小さくなり改良された事が明らかである。

[0028]

産業上の利用可能性

以上の様に、水、アルミナ、研磨促進剤にHPC及び/又はHRRCを加えた本発明の研磨用組成物は、所定の研磨速度、面精度、表面欠陥のない高鏡面を維持し且つ縁グレ量の少ない優れた研磨性能を得ることができる。

[図画の簡単な説明]

[3]

緑ダレ量を規定するための説明図である。

[符号の説明]

S…サーフコーダーによるディスク外間端近傍の描線

h…ディスク外周端部に接する垂線

A…業線もより描線上の3000amに位置する点

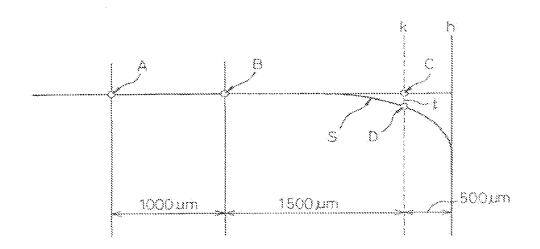
B一番線由より描線上の2000μmに位置する点

C一点A、点B、を通る直線上で垂線 hより500mに位置する点

k…点Cを通る垂線

D…垂線 k と描線 S との交点t …点○と点D間の長さ(縁ダレ風)

Fig.1



(国際調査報告)

	international seal	RCH REPORT	Francisco de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa	
			PCT/3P 00	stantion No : /n.c.n.c.s
	new weeks the door some sent times		TERMOL NO	4.46005
îrc 7	RECATION OF SUBJECT MATTER COSG 1/G2 COSK3/14			
According)	p dissentational Polisial Dissendication (DPD) or so book subsendication	Secultination and PC		************************
********	SEARCHED	navata makai		·····
Ibč 1	COBB CORK CT3E connections connected, legislaping in state of inspect in ground pily app	economics of services		
Doctoropisto	pain resources (spiral, pains supplement approximation allows to just copies	re that successorate and in	Medical in Dis Mettic a	escaped
(Deckeeler ii	eas these consistes the my the innerestational sensite freeze or	data band and, where precise	as, reacourable terrino, aravo	
WPI Da	ta, PAJ, EPO-Internal			
e eccus	ents considered to be relevant			**************************************
Celegory *	Cassica da decomiena sean macaston, lemese activolmentes of	the relevant pleasages		Rediriught in obdin bio.
۴,٤	EP 0 967 286 A (FWNMI INC.) 29 December 1993 (1999-12-29)			1-4, 2-11, 14-16, 21-23
:	page 3, line 43-50 page 4, line 2-4 page 4, line 47-54		:	
¥.	EP 8 842 897 A (NISSAN CHEMIC 20 May 1998 (1998-05-20)	AL IND.)		1-4,9, 10, 12-15, 19,21,22
	absbract page 2, paragraph 1 page 3, line 34-47			
		a frank		
	or recommenda una listaci la tra comministica del bosa G.	Padara jansa	Constitution are tested	Su spesso,
	//////////////////////////////////////	E.J		
A" BOOKING COMMO	Suggestion of calend distributions () and discipling their personal states of their aid subsects to Aria event to be not principles recognisation.	"Y" beter decorrent to be priority details cloud to Undersity investigate	tilebred the the him let act to contact with act the pranciple of the	(0.0 spc)00036006 (0.00
\$ \$2866 27 (2000) 27 (2000)	to closel to englishing doubtion to provide closel(b) of	"K" absorbent af parti connet de comes kwene an kwen "T" decorbent af parti	jenera stone such attended New Stone Newschild (New Co.)	entitete in 1980) intole He Contrapology
Charles Charles Appendix	r on atomic special imparoni taac approvident) ed valennary ta our drad disclarures, sing, apptitivition or	to the set, confidences to confidences to confidences to confidences to confidences the confidence the	philagos piaod dansi galad day mai al ar galad to jumpo al a	ración a liberación apaglaci Nacionapión, instato grapa- usivostria espár sociato guar
687.686	se the county that channed	'8' theorement neithing o	e ciñ bbie santier parairi Litter inberskeberher bee	
	January 2001	16/61/		
Spare sold re	1000 ng abbrook of the ISA Boropeus Pisters Office, P.B. 5416 Patentiane (5), – 2006 No Reports	Sudport bod officer		
	Tol. (+31-70(380-3360, In. 31-681-4901). Exp. (+31-30) 340-3460	àirard	Å	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ind Jones Application No PCT/JP GG/G680S

	Elektrisent in childre ben.
US 4 645 561 A (AMPEX CORP.) 24 February 1987 (1987-02-24)	1-4,9, 16, 12-15, 19,21,22
obstract culumn 2, line 23-32	
US 4 915 710 A (SHOWA DENKO K.K.) 16 April 1990 (1990-04-10) Abstract 8 OP 02 084485 A 26 March 1990 (1990-03-26) cited in the application	5,5,8, 12,18,80
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26 December 1995 (1995-12-26) 3 OF OT 216345 A (FUJINI INKOPPORETETSUDO:kK), 15 August 1995 (1995-08-15) cited in the application abstract	5.5

	24 February 1987 (1987-02-24) obstract column 2, line 23-32 US 4 915 710 A (SHOWA DENKO K.K.) 16 April 1990 (1990-04-10) abstract 8 0P 02 084485 A 26 March 1990 (1990-03-26) cited in the application PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26 December 1995 (1995-12-25) 8 0F 07 215348 A (FUJINI 1NKOOPONEETETSUDO:KK), 15 August 1995 (1995-08-15) cited in the application

3

	version de la company		Franklinger	ر المحمد على المدالية المساورين و و المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية الم	Patent family		
0868 8-8	tent document in sesson repos		Putdication date	uswents) -sett stork	·	Puddienion data	
	987260	A	29-12-1999	NONE			
£₽.	842997	Ą	20-05-1998	JP 101954 US 60075		28-07 - 1999 28-12-1999	
	4645563	A	24-02-1987	NONE		and the second s	
	4915710	A	10-04-1990	JP 17740 JP 20844 JP 40367	85 A	34-07-1993 26-63-1996 25-06-1991	
	07216345	Ą	15-08-1995	NONE			

Energy 2000 (Section program (section) is consent trady (MAS).

フロントベージの続き

CDDInt.CL*

鐵翔記号

GIIB 5/84

FI

テマコード (参考)

G11B 5/84 EP(AT. BE, CH. CY. (81)指定图 DE, DK, ES, FI, PR, GB, GR, IB, I T. LU, MC, NL. PT. SE), OA(BF, BJ CE, OG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR. NE. SN. TD. TG), AP(GH. GM. K E. LS. MW. MZ. SD. SL. SZ. TZ. UG . ŽW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MĎ, RU, TJ, TMJ, AB, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, C A. CH, CN. CR, CU, CZ, DE, DK, DM , DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, TD, TL, IN, IS, JP, K E, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT , LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO. NZ. PL. PT, RO. RU. S

D, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR . TT, TZ. UA, UG, UZ. VN. YU. ZA,

(72)発明者 永尾 思徳

Ž.W.

爱知県名古屋市緑区鳴海町母呂後153番地 山口特研工業株式会社內

(72)発明者 林 阜樹

愛知界名古屋市緑区鳴海町母呂後153番地 山门特研工業株式会社内

F ターム(参考) 3C047 FF08 CX20

3C049 AA97 AC04 CB01 3CH58 AA67 CBOL DA02 SDI12 AA62 BA06 BA09 CA14

MicroPatent® Family Lookup

Stage	1 P:	atent Family - '	Com	plex	Priorities and Applications					
	CC	Document Number	, KD	Publication Date	CC	Application or Priority Number	KD	Application or Priority Date		
***************************************					AU	7450900	D	20000929		
	AU	7450900	Α	20010430	JP	27911299	A	19990930		
				÷	JP	0006805	W	20000929		
*************					EP	00963009	A	20000929		
	EP	1141154	A1	20011010	JP	0006805	W	20000929		
				• •	JP.	27911299	Α	19990930		
***************************************			*****		EP	00963009	Α	20000929		
	EP	1141154	81	20050817	JP	0006805	W	20000929		
					JP	27911299	A	19990930		
***************************************					JP	2001526873	Ť	20000929		
	JP	2003510446	1	20030318	JP	27911299	A	19990930		
				JP	0006805	W	20000929			
	**********				JP	2001526873	T	20000929		
	Jp	3781677	82	20060531	JP	0006805	W	20000929		
				· ·	JP	27911299	A	19990930		
************					US	22464802	Α	20020821		
لسط	5 1 PM	2000000000	8.4	20020213	JP	27911299	A	19990930		
	US	2003029095	A1	20030213	US	67277400	A	20000929		
	v.			en e	US	18628400	p	20000301		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************			US	67277400	A	20000929		
	US	6488729	81	20021203	JP	27911299	A	19990930		
					us	18628400	þ	20000301		
	E E E E E E E E			÷	US	22464602	A	20020821		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 ()*c.	the last the same time and the	Sec.	dynakana dynakana	JP	27911299	Α	19990930		
	US	6607571	ಶಿಷ	20030819	US	67277400	A	20000929		
					US	18628400	P	20000301		
pression and a second		oppy han koe	ж ъ ъ	90010406	JP	0006805	W	20000929		
	AAO	2001023485	74.3	ZUUTUĄUD	JP	27911299	A	19990930		

information on the right

covers the corresponding application and priority data for each publication.

Legend: CC=Country Code KD=Kind (Publication kind can differ from application/priority kind.)